Customer: ALPS EUROPE DISTRIBUTION Attention: Your ref. No.:

Your Part No.: RK50112A000F

No. KK-2006-2170 Date: Oct. 31, 2006

SPECIFICATIONS

ALPS';

MODEL: RK50112A000F (50kAX2)

Spec. No.:

Sample No.: F3494418M

RECEIPT STATUS RECEIVED By Date Signature Name Title



DSG'D J. Tamada APP'D **S. ikenaw** ENG. DEPT. DIVISION

Head Office

1-7, Yukigaya-otsuka-cho, Ota-ku, Tokyo, 145-8501 Japan Phone,+81(3)3726-1211

Sales

B6523

SPECIFICATIONS

- 1. THIS SPECIFICATIONS APPLY TO RK50112AO POTENTIOMETER.
- 2. CONTENTS OF THIS SPECIFICATIONS. 4K5021-2 K50210001

3. MARKING

• MARKING ON ALL UNITS
DATE CODE, RESIST. VALUE, TAPER

4. REMARKS

- FURNUSH PACKAGE NUT:1 WASHER:1 (H=14)
- NOTES
 - ·Marking \Rightarrow in specifications shows standard and condition for application.
 - .The surface of the case is covered with grease.

CAUTION

Regardless of the suggested applications of these products being introduced in the specifications, when using them for equipment and devices requiring a high degree of safety, respective manufacturers will please preserve safety of the planned equipment and devices by providing necessary protective circuits and rodundancy circuits and reconfirm if safety is being duly preserved.

Products being introduced in the specifications have been designed and manufactured for applications to ordinary electronic equipment and devices such as the AV equipment, electric home appliances, office machines and communications equipment. Consequently, when employing these products for applications requiring a high degree of safety and reliability such as the medical equipment, aviation and aircraft equipment, space equipment and burglar alarm equipment, the using manufacturers will please thoroughly study the proprieties of these products for the planned applications.

Although we are exerting our best efforts to maintain the quality of these products, we cannot guarantee that they will never cause short circuiting and open circuitry. Therefore, when designing an equipment or device with which the priority is given to the safety, you will please carefully study the influences to the whole equipment of a single function failure of Potentiometers and Encoders in advance to make out a fail-safe design providing.

1. Scope

This specification applies to potentiometer with carbon composition resistor. used in electronic equipment. この仕様重は電子機能 機に用いちれる炭素系統体を用いた可変整体器について規定する。

Rotational (____ shaft _ ___ story ,

2. construction 構造

2.1 Dimensions and materials

寸法・材料 別編参服

Refer to the attached

APPO ALPS ELECTRIC CO., LTD.

APPO CHKD DSGD

CHKD DSGD.

TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DESTRICTED

DSGD.

TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DESTRICTED

DSGD.

TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DESTRICTED

DSGD.

THE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DSGD.

THE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DSGD.

DSGD.

DSGD.

TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DSGD.

DSGD.

DSGD.

TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DSGD.

DSGD.

DSGD.

TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER

DSGD.

94. 04. 25

3. Characteristics 性能

Standard atmospheric conditions

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric

conditions for making measurements and tests is as follows:

Ambient temperature : 15% to 35% Relative humidity : 25% to 85% Air pressure : 86kPa to 106kPa

If there is any doubt about the results, measurements

shall be made within the following limits:

Ambient temperature : 20±10 Relative humidity : 63% to 73% Air pressure : 86kPa to 106kPa

Temperature for operating and storage

Dimensions: See attached drawing Operating temperature: -10°C~+70°C Storage temperature: -20°C~+80°C

〇標準状態

特に指定がない限り測定は常温(温度15~35℃)、常湿 (湿度25~85%)、常気圧(気圧86~106kPa)にて行う。

ただし、判定に疑義を生じた場合は温度20±1℃、湿度

63~73%,知E86~106kPalZで行う。

○-酸性能

形状・寸法は組立図による.

使用温度範囲:-10°C~+70°C 保存温度範囲:-20°C~+80°C

3.1 Mechanical characteristics 機能性

	ltem 項目		Conditions 条 件	Specific 規	ations 格
1	Total mechanical rotation 全回転角度	Angle of effec 有外回配角度	ctive rotation	300.	±3°
		Potat ional	Standard atmospheric conditions 常温15°C to 35°C	28±15	mN⋅m
2	Rotational torque 回転トルク	Rotational speed 回転度 S 60°/钟	0 C±2.C	100 mN⋅m	n or less
			+50 T±2°C	13 mN⋅m	or more
Э	Terminal strength 關子強度	for 10 s in a	of 5 N Shall be applied to the terminals any direction. 移向重を104個加えた後期定する。	without exces terminals or 著しいガタ、および ないこと。	poor contac
4	End stop strength ストッパー強度	be applied to	g torsion moment load of 1.5Nm Sha!! the shaft for 10s at both ends. Dネジリモーメントを両端末にそれぞれ10//間	Without dam play in. sh abnormality rotational Electrical characteris be satisfie	aft. No in torque. tics shai d.
		A momentary lo point 5 mm from to the axis	pad of 100mm·m shall be applied at the tip of the shaft in a direction perpendicular	異常がなく電気的特 Shaft length 軸長(mm)	性を満足するこの mm p-p or less 両側(mm)
5	Bending or play in shaft 触の曲りおよびガタ		位置と100mN・mのモーメントを軸と直角に する。但し反対位置からもモーメントを加え両方の値ををすこととする。	20 25 30 35	0. 2以下 0. 25以下 0. 3以下 0. 35以下
				40	0. 4以下

			AU	BAL	PS El	LECTR	IC CO., LTD.
			APPD. 1技-2G	CHKD. 1技-2G	DSGD. 1技-2G	TITLE ROT	ATIONAL POTENTIOMETER 回転形可変抵抗器
初 設 94-8-30 /丘首 SYMB DATE APPE	人 CHKD	神崎 DSGD	1007.06	(100. 7. 0 6 生々木和	20. 76	DOCUMENT N	4 K 5 0 2 1 - 2 (2/2)
				T II			DSG1, 8502781 Y. KANZA

94. 04 (2) R

I tem 項目	Conditions 条 件	Specifications 担格
Thrust and tensile shaft 動の押しおよび う際り強度	Thrust and tensile static load of 150N Shall be applied to the shaft in the axial directions for 10 s. 軸が押し方向および号院方向に150Nの特荷重を10対荷加える。	Without damage to: or play in. shaft. No abnormality in rotational torque Electrical characteristics shall be satisfied. 軸のガタ、および破構、回転トルクに異常がなく。 電気的性能を満足すること。
Nut-tightening strength フット締付完度	Installation torque of 2N-mi shall be applied to tighten the nut. However, the upper part of the nut shall be set 1.0mm or more lower than upper part of the bushing. 2N・mのトルクでナットを経付ける。をだし、ナット上部が確定け上部より1.0mm 以上沈小友状態で使用されている場合とする。	Rotational torque shall be 120% or less before nut is tightened. The difference between maximum and minimum value in the same direction. shall be 5 mN·m(51 gf·cm) or less. Without rotational deviation. 回転トルクはナット統付け前の120%以下。また同一方向で載大と最大の差は 7 mN·m以内とし回転人が変性を含むこと。

					AU	A	LPS E	LEC	TRIC CO.	, LTD.
					APPD. 1#-2G	CHAND.	DSGD. ·	TITLE	回転形可変抵抗器	NT LOMETER
刃設 SYMB	94-6-7 DATE	佐藤 APPD	기 나 가	神崎 DSGD	100.7.06	也本种	90. 76	DOCUM	ENT NO. 4 K 5 0 2	1-2(3/12)
,									DSG1. 850	2781 Y. KANZA

		characteristics 電知性能	
	item 項目	Conditions 条 件	Specifications 規格
1	Nominal total resistance and tolerance 公特全抵抗値 および耐容差	The resistances between terminals 1and 3 shall be measured	5 0 K Ω±20%
2	Resistance law 抵抗変化特性	Measurement shall be made by the resistance law method; For other procedures, refer to IEC Pub. 393-1. 電圧起て測定。その他 JIS C 5261 に準拠する。	Taperカーブ Refer to the attached
3	Power rating 定格電力	Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3 Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と30同ご総統負荷するごとが出来る最大電力。 関西温度で対する。電力解測機能が図とする。	0. 1 W
4	Rated voltage 定部配任	Rated voltage E= ✓PR Maximum operating voltage 景高使用電圧 Where P: 定格電力 R: Nominal total resistance (Ω) when the rated voltage exceeds the maximum operating voltage.	150 v a. c.
5	Resistance- temperature characteristic 抵抗温度特性	The potentiometer shall be maintained in a thermostatic chamber at a temperature of 70±3 で without electrical load for 5h. after which the total resistance shall be measured immediately. 温度 70±3℃の信息者に無負荷で5時間改置後、ただちにそままの状態で、全抵抗値を測定する。	Change in total resistance is relative to the value before test 全抵抗値の変化は +5 初期値で対して -20 %

,						AU	A	LP	S E	LEC	TR	IC	: C	O).,	L	TE).
					APPD.		CHKD. 1一設 2 94.6.06	1 /	5GD.	TITLE		0	形可变机	抗器	ENT	10M	IETEI	?
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	94.6. 佐藤	' /\			94.6.03 神崎	росим	ENT NO	4	K 5	0	2 1	_	2 (4	(//2)
			I										DSG	1. 8	5027	81	Y. K	ANZA

	item 相	Conditions 条	Specifications 费格
6	Attenuation and insertion loss 最大演奏量と 挿入損失	The attenuation and insertion loss at each end of Angle of effective rotation shall be measured. And the attenuation and insertion loss shall be induced from the first unite. When the A.C.10V is applied between terminals 1 and 3 and the second unite by frequency of 10KHz (20)	Total resistance 全抵抗衛 果大派表費 less than or less 10kQ未満 -110dB以T or more or less 10kQ以上 linsertion loss 全抵抗衛 insertion loss 全抵抗衛 insertion loss 10kQ未満 -2dB以下
7	Jump-off resistance 跌 躍	when the moving contact passes from the silver area to the resistance area. the magnitude of change caused by this sudden change in voltage shall be measured.	or more or less 10kQ以上 -1dB以下 0.01% or less of the nominal voltage.
8	Sudden change in voltage 逆 行	をだし、その他のカープは探定しない。 5 V d.c. shall be applied to the terminals between 1 and 3 and the following jump-off voltage shall be measured. 端子1-3間にd. C. 5VEMML、逆行可正を測定する。 Taper ~ Between terminals 端子間 10A、15A、3B 1-2 However, other taper shall not be specified. をだし、その他のカープは感じしない。	0.01% or less of the nominal voltage.
9	No ise 探験音	20 V d. c when the rated voltage is 20 V or less. its rated voltage shall be applied to the terminals between 1 and 3. And then the noise shall be measured by the specified speed. 端子1-3間と高帝昭王20V(定格が20V以下の時は、その帝王)を加えこのと世に発生する雑音電圧を測定する。 Shaft rotation rotations/min 30 回 / 分 For other procedures. refer to IEC Pub. 393-1-6. Test Method A. その他 JIS C 5261 A 法による。	iess than 20 mV p-p 未清
10	Insulation resistance 総載抗	A voltage of 500 V d.c. shall be applied 1 min after which measurement shall be made. d. C. 500V. 1分後	100 MQ or more 以上
		Trip current Between individual terminals and frame/shaft	Without damage toparts. arcing or breakdown etc.

The moving shaft shall be rotated at the specified speed. And the electrostatic noise shall be induced between terminals 1 and 2 or between terminals 2 and 3. Rotational potentioneter 5 ので、分別では、		I tem	Conditions		Specifications
and between terminals 1'to 3'bv measuring frequency at 1 Hz, The output voitage shill be measured between terminals 1 and 2 and between terminals 1 and 2 and between terminals 2 and 3 and between terminals 2 and 3 and between terminals 2 and 3') units the first of these shall be the standard one. If there is not any doubt about the results. d.c. voitage shall be used as the test voitage. If racking error 2 (1-15) (FEX.PAM.D) (PM.D) (1-15) (FEX.PAM.D) (PM.D)		項目			規 格
And the electrostatic noise shall be induced between terminals 1 and 2 or between terminals 2 and 3. Without noise 発生しないこと。 Rotational potentiometer s	- 1	Tracking error	The voltage of 2 V r.m.s. shall be applied between terminals 1 to 3 by measuring frequency and between terminals 1 to 3 by measuring frequency as the output voltage shall be measured between terminals between terminals 1 and 2 (for the 15 C and 25 C tape measurement shall be made between terminals 2 and 3 at terminals 2 and 3 i) units the first of these shall tone. If there is not any doubt about the results. d. obe used as the test voltage. は子1-3局、は子1・3 高元それぞれ1kHZで2~15V(正弦疾政論)の電圧を加え、 耐致を基準としては子①-2局、端子①・2 局(15C、25Cカーブの場合は、2-3局、2・3局)の出力電圧を設する。なお、単定に設轄が生しなければ、減減電圧として直流を用いてもよい。 Input impedance of the voltmeter : 10MQ 以 上 インピーダンス 3(1) 3 (1) 1kHz 2 2 2 15V 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	at 1 kHz. Is 1 and 2 and er. the and between be the standard c. voltage shall Total resistance 全核抗值 less than 10kΩ 末満 or more 10kQ以上	-80dB ~ 0dBにて withi ± 3 dB以内
taps 1 and 4.) 公许タップ回(1-4回)核が適および肝容差は The end resistance between intermediate taps (Between taps 2 and 4) 中間タップ(2-4回)残害性が過ま Tap タップ Tap タップ	L3		And the electrostatic noise shall be induced between 1 and 2 or between terminals 2 and 3. 略を指定の速さて回転させながら1-2端子間、2-3端子間にて測定する。 Rotational potentiometer s		
taps 1 and 4.) 公许タップ間(1-4間)抵抗語および肝容差は The end resistance between intermediate taps (Between taps 2 and 4) 1% or less of the nomin resistance. (Max. 500 g or less) 公许全抵抗節の1%以下 (最大500以下とする)			•		
14 Tao タップ するタップ (2-4局)残害性抗菌は (Max. 500 g or less) 公许全抵抗菌の1%以下 (最大500以下とする)			taps 1 and 4.)	s (Between	Ω ± 30
	14			en taps 2 and 4)	resistance. (Max, 500 Q or less) 公许全抵抗菌の1%以下
Qu. 7价量料 17 研究		٠.	Tap position and tolerance タップ位置および称容差		± 3°

					AU	AL	PS E	LECTRIC CO., LTD.
					1-222	CHKD. 1-数2	DSGO. 1 一款 2	TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETER 回転形可変抵抗器
A I A I SYMB	95-6-8 94-9-28 DATE	川崎	产榜 CHKD	新 神崎 DSGD	佐藤	94.6.06	94.6.03	DOCUMENT NO. 4 K 5 0 2 1 - 2 (6/12)

94. 04. 25

	item	Conditions	Specifications
1	項目 Solderability はんを付け性	条件 The terminals shall be stored at a temperature of 100°C with relative humidity of 100% for 16h. after which mesurement to "Menisuco graph solderability" 温度100°C、湿度100%RHに16時間設置後、メニスコク*ラフ(230°C非活性ロシ*ン)にて利定する。	担 格 (1) Solder wetting time shall be 3 s or less. はた空和時間 3. Oが決内 (2) A new uniform coatin of solder shall cover a minimum of 95% of the surface being immersed. はたど表面積の95%以上新しいはたて濡れていること。
2	Resistance to Soldering heat は九七剛独生	For procedures other than those specified below. refer to IEC Pub. 68-2-20. Test To Method 1A or 2. TEDのほかは JIS C 0050 (ただし確認がなは1Aまたは2による)に準拠する。 Solder bath method ディッフ・の場合 Bit temperature 温度: 260±5°C Immersion time 多時間: 5±1分 Pre heat temperature and immersion time 温度: 120±10°C 時間に2分 This procedure constitutes 1 cycle and testing 2cycle 以上を2回繰り返す。 Thickness of heat shunt (Printed wiring board) 熱産業板(プリント基板)の原さ : 1.6 mm Material Single sided copper clad laminate 材質 片面配料機能板(プリント基板)の原さ : 1.6 mm Dimensions of component holes in the heat shunt (Printed wiring board) shall be in accordance with those specified in this specification. Bit temperature : 350±10 ℃ Extensive pressure must not be applied to the terminal soldering iron : 5 +1 S O 分 包し 能子に異常知圧のないこと。 時間	Change in total resistant is relative to the value before test 全板坑面の変化は 初期値の ±5% Electrical characteristic shall be satisfied. Without distinct deformation in appearance. 電気的性能を満足すること。 外間ご替しい変化がないこと。
3	Resistance to flux penetration 耐フラックス上がり	For test method, refer to page. "Test Method for Resistance to Flux Penetration." 減減方法は別様の「耐フラックス上がり減減方法」による。 Nominal board thickness : 1.6 mm	Electrical characterist and characteristics sha be satisfied. 電対的性能。機械的性能を 満足すること。
4	Dry heat 耐熱性	The potentiometer shall be stored at a temperature 70±2°C for 240±8h in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be maintained at standard atmospheric conditions for 1h after which measurements shall be made. For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-2. Test Bb. (Forced air circulation may be used.) 温度70±2℃の恒温時代で240±8時間放置し、常温常星中に1時間放置後期にする。 その他 JIS C 0021 定準期する。	Change in total resistal is relative to the value before test 全抵抗菌の変化は初期論の + 5 % -20

	,				Au	BA	L	PS El	LEC	TRIC CO., I	LTD.
					APPD 1-1223	CHKD. I一設	_	DSGD. 1 − ∰ ?	TITLE	回起河交抵抗器	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	94.6. 7	94.6.0		94.6.03	DOCUM	^{1ENT NO} 4 K 5 0 2 1 -	2 (1/12)
		L								DSG1. 850278	

item 項目	Conditions 条 件	Specifications
<u> </u>	The potentiometer shall be stored at a temperature of -20±3	規格 Change in total resist
	C for 240±4 h in a thermostatic chamber. Then the potentiomet-	is relative to the val
	ers hall be taken out of the chamber and its surface moist-	before test
	ure shall be removed. And then the potentiometer	全抵抗値の変化は
	shall be subjected to standard atmospheric conditions for	
	1 h. after which measurement shall be made.	初期値の ±20%
Cold		
Cold	For other procedures, refer to IEC	
耐寒性	Pub. 68-2-1. Test Ab. (Forced air	
	circulation may be used.)	There shall be no date
	温度-20±3℃の恒温槽中に240±4時間故置後とり出し、表面の水分をふきとり常温	tion or cracks of mole
	常急中に1時間数置後期定する。	part.
	その他 JIS C 0020 に準拠する。	成形部分に変形、クラックが
		ないこと。
		** 00:
		1
	The potentiometer shall be stored at a temperature of	Change in total resist
	60±2 T with relative humidity of 90% to 95% for 240±4 h in a	is relative to the val
1	thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be taken	before test
	out of the chamber and its surface moisture	全抵抗菌の変化は
	shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected	初期強の +25 %
1	to standard atmospheric conditions for 1 h. after which	- 5 %
1	measurement shall be made.	Insulation
	For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-3,	resistance 20 MQ or
	温度60±2℃、湿度90~95%の配置反射中に240±4時間放置した後とり	经验帐款
Damp heat	出し、表面の水分をふきさり常温常澤中に1時間散置後期にする。	Noise Less than
新爆性		海岬音 100 mVp-p
1	その他 JIS C 0022 に準拠する。	SELVER 100 HIVD D
	•	
	·	
	The potentiometer shall be subjected to 5 successive change	
1		IChanga in total recict
. '	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	of temperature cycles, each as shown in table below.	is relative to the val
	of temperature cycles, each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed.	is relative to the val
	of temperature cycles, each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard	is relative to the val before test 全抵抗節の変化は
	of temperature cycles, each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements	is relative to the val
	of temperature cycles, each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made.	is relative to the val before test 全抵抗論の変化は 初期値の ±20%
	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下記に示した温度サイクルを過滤ら回行なう。	is relative to the value before test 全抵抗菌の変化は 初期値の ±20% Clause 3. 2. 10 shall be
	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した温度サイクルを過滤を回行なう。	is relative to the val before test 全抵抗節の変化は 初期節の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied.
	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下記に示した温度サイクルを過滤ら回行なう。	is relative to the val before test 全抵抗論の変化は 初期論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10病を満足すること。
	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過度の回行なう。表面の水分をみきとり常温常を中に1時回数温を設定する。 Temperature Duration 選 度 数量時間 Dielectric strength	is relative to the val before test 全抵抗論の変化は 初期論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be
Change of	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した温度サイクルを過去ら回行なう。 表面の水分をふきとり常温常気中に1時間改造技術でする。 Temperature Duration 第二 は Dielectric strength 開発主	全抵抗論の変化は 初期論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied.
Change of temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下記にいる場合した。 下記にいる場合している場合の行なう。 表面の外分をふきとり常息常を付て1時間は運化制でする。 Temperature Duration 第二 度 第二時間 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	is relative to the val before test 全抵抗論の変化は 初期論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去ら回行なう。 表面の水分をふきとり常温常度中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 2 度 対象時間 1 -10±3 で 30 min Dielectric strength 解理王	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 初期値の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafo
	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去ら回行なう。 表面の水分をふきとり常温常度中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 2 度 対象時間 1 -10±3 で 30 min Dielectric strength 解理王	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mole
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常度中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 设置時間 1 -10±3 で 30 min Dielectric strength 解理王 Stnadard atmospheric conditions 10 to 15 分 和 和 Pearance 外 和	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dato tion or cracks of mole part.
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度を回行なう。 表面の水分をふきとり常識性を行われて1時間設置を設定する。 Temperature Duration 漫画 度 知識情 Dielectric strength 計画 1 -10±3 で 30 min 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10所を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常度中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 漫画 所加 Dielectric strength 解理王 Stnadard atmospheric conditions 加加 力 to 15 分 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part.
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常度中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 漫画 所加 Dielectric strength 解理王 Stnadard atmospheric conditions 加加 力 to 15 分 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10所を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常気中に1時間放置後期でする。 Temperature Duration 没事情 1 -10±3 で 30 min 分 Stnadard atmospheric conditions 10 to 15 分 和 3 70±2 で 30 min 分 和 3 70±2 で 30 min 分 和 4 conditions 10 to 15 分 和 4 和 5 分 和 5	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常学中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 设置時間 1 -10±3 で 30 min 分 Stnadard atmospheric 2 conditions 10 to 15 分 和 3 70±2 で 30 min 分 Stnadard atmospheric min Stn	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10所を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常気中に1時間放置後期でする。 Temperature Duration 没事情 1 -10±3 で 30 min 分 Stnadard atmospheric conditions 10 to 15 分 和 3 70±2 で 30 min 分 和 3 70±2 で 30 min 分 和 4 conditions 10 to 15 分 和 4 和 5 分 和 5	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10所を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目立つ。 表面の水分をふきとり常温常気中に1時間放置後期でする。 Temperature Duration 没事情 1 -10±3 で 30 min 分 Stnadard atmospheric conditions 10 to 15 分 和 3 70±2 で 30 min 分 和 3 70±2 で 30 min 分 和 4 conditions 10 to 15 分 和 4 和 5 分 和 5	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10所を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度分グルを過度分配する。 下表に示した過度分グルを過度分配する。 Temperature	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目存力。表面の水分をふきとり常温常見中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 2 度 2 回 面前 2 回 2 回 面前 2 回 2 回 2 回 面前 2 回 a 回 2 回 2 回 a 回 2 回 a 回 2 回 2 回 2 回	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目存力。表面の水分をふきとり常温が受けて1時間が運化を設する。 Temperature Duration 注 度 以事情 Dielectric strength 報題任 1 -10±3 で 30 min 分 Stnadard atmospheric conditions 10 to 15 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no daft tion or cracks of mole part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目存力。表面の水分をふきとり常温常見中に1時間設置後期でする。 Temperature Duration 2 度 2 回 面前 2 回 2 回 面前 2 回 2 回 2 回 面前 2 回 a 回 2 回 2 回 a 回 2 回 a 回 2 回 2 回 2 回	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10項を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが
temperature	of temperature cycles. each as shown in table below. Then is surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 h after which measurements shall be made. 下表に示した過度サイクルを過去の目存力。表面の水分をふきとり常温が受けて1時間が運化を設する。 Temperature Duration 注 度 以事情 Dielectric strength 報題任 1 -10±3 で 30 min 分 Stnadard atmospheric conditions 10 to 15 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min 分 Min 分 Stnadard atmospheric 4 conditions 10 to 15 分 Min	is relative to the value before test 全抵抗論の変化は 打測論の ±20% Clause 3.2.10 shall be satisfied. 3.2.10所を満足すること。 Clause 3.2.11 shall be satisfied. 3.2.11項を満足すること。 There shall be no dafotion or cracks of mold part. 成形部分に変形、クラックが

					AU	A	LP	S El	LEC	TRIC CO., LTD.
					APPD 1-数2章 34.6. 7 佐藤	94. 6.	2 06	94.6.03	TITLE .	回転形可変抵抗器
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD		川崎	<u>ノ」</u>	神殿	<u> </u>	ENT NO. 4 K 5 0 2 1 - 2 (8//2) DSG1. 8502781 V. kanzal
		_		•		J		<u>.ll.</u>		94. 04. 25

Item	Conditions	Specifications
順	条 件	規格
	The moving contact shall be placed about half way (50%) in	Without intermittent con-
	the angle of effective variable range.	1
		tacts or open circuiting
	Only endurance conditioning by a frequency sweep shall be made.	between terminals.
ľ	The entire frequency range, from 10 Hz to 55 Hz and return	各端子間で開発がないこと。
Vibration	to 10 Hz. shall be transversed in 1 min.	
耐振性	Amplitude (total excursion): 1.5 mm	Rotational torque, and end
阿尔 尼土		stop shall not deviate fr
·	This motion shall be applied for a period of 2 h in each of	the previously specified
. [3 mutuslly perpendicular axes (a total of 6 h).	value.
· ·	For other procedures, refer to IEC Pub. 68-2-6.	回転トルク、ストッパ強度は初期規格組
	有が何変範囲のほぼ50%の位置で描述ける置き、 撮影の割合10~55~10 HZ/分。	
ľ		満足すること。
ŀ	全線框1.5mm. X·Y·Z方向に各2時間。	1
	その他 JIS C 0040 に準態する。	.
	Peak acceleration	Without deformation of
ł	Peak acceleration : 981 m/s²{100 G}	case or excessive
	Duration of the culon	looseness of teminals.
	Duration of the pulse : 6 ms	
Shock	作用相	外観の変形および端子などの
耐衝擊性	Three successive shocks shall be applied in both directions	著しいガタがないこと。
·	of 3 mutually perpendicular axes (a total of 18 shocks).	1
	For other procedures, refe to IEC Pub. 68-2-27.	1
	6m×30(#180)	
l	その他 JIS C 0041 に準息する。	1
	The potentionmeter shall be stored at a	Noise shall be relative
	The potentionmeter shall be stored at a H ₂ S density: 1ppm. tempreture: 40°C.	three times less to the
	relative humidity: 70% at 75%, for 96h in	value befor test.
	thermostatic chamber. after which measurments	The attennuation and in-
	shall be made.	sertion loss shall not
	H ₂ S 満度1ppm, 温度40°C 70-75%RHの増加ご96H放置後期にする。	deviate from the previous
	150 WATDOM STAC C 10 10/00/10/18/2001 INSERNICAO	speciffied value.
		SPECIFIED VALUE.
.		
Resistance to		福町離音,は初期投格値の3倍以下。
0 sulfuration		
耐硫化性		また。最大演奏量、挿入損失
M100.03		は、初期技格値を満足すること。
	· ·	
		· ·
		l.
		į
	The moving shaft, without electrical load, shall be rotated	Change in total resistan
	from end stop to the other and returned to its original	is relative to the value
	position extended over 90% or more effective angle.	
		before test.
	This procedure constitutes 1 cycle. And the moving	全抵抗値の変化率は
	shaft shall be subjected to 600 cycles per hour, a total	初期値で対し ±15%
	of 15000±200 cycles (5000 to 8000 continuous cycles for 24h)	Noise Less than
	Measurements shall be made immediately after 5000 cycles.	•
i	•	播贈 47 mVp-p 和
4	immediately after 10000 cycles.	
1 Endurance	無負荷で軸を600回/時(1往後1回とする)の速さで有が回転	
<u>.</u>	角度の90%以上にわたり1日激発5000~8000回。 合計 15000±200回 回転させる。	
動作耐久性	ただし、減減中5000回および10000回においても測定する。	
1	CCO SANTOCOCKOO LOCOCKOO COMPLY OF	
1		
		•
		1 .
		1
ł .		
		l l

			<u> </u>		AU	ALPS ELECTRIC CO., LTD.									
					1-27 94.6. 7	CHKD. 1-設2		1-22		TITLE ROTATIONAL POTENTIOMETE 回転形可変極抗器					
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	佐藤	94.6.0		94.6.03	DOCUME	NT NO. 4	K 5 0	21	- 2	(9/12)	
					<u> </u>						DSG1	85027		/. kanzal 04. 25	

4. NOTE ₹の他

- 4.1 The outside appearance 外版
 - The appearance is an easily changing color. Because this products case is made of the brass, that is an easily oxidizable metal.

本製品は外観部に黄銅材を使用しておりますので、酸化等により自然変色致します。

2) Without deformation distinct a flow striked damage change color, in appearance.

著しい傷、打痕、人為的変色等の無い事、

3) Pay attention shoud not catch up potentiometer in the naked fingers. It may cause a changing color apperance for sweat of fingers.

製品を素手で擱むと指の汗、水分等により変色する恐れがありますので、使用上ご注意下さい。

4) In operation, storage in high tempreture and humidity, and in corrosive gas, shall be avoided.

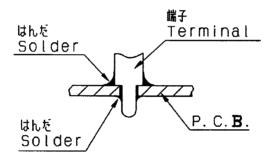
製品の保管は高温・高湿な場所、腐食性カース中は外観が変色する恐れがありますので避けるようお願いします。

- 5) This product is made for a.c. use only. Please do not use d.c. voltage. 本部品はa.c. 専用ですのでは.c. での御使用はお遊り下さい.
- 6) Caution for soldering

はんだ付け時のご注意事項

Please avoid soldering on upper surface of P.C.B. as shown.

図のようP. C. B. の上面にはんだをする配線はお避け下さい。



					Au	B AL	PS E	LEC	TRIC CO., LTL).
					APPD.	СНКО.	DSGD 1一数 2	TITLE	ROTATIONAL POTENTIOMETE 回転が可変抵抗器	R
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD	94.9.02		神崎	DOCUME	0 0 1 - 2	0/12)
		L							DSG1. 8502781 Y	ANZA

TEST METHOD FOR RESISTANCE TO FLUX PENETRATION 耐フラックス上がり試験方法

1. Materials

(1) Solder

Refer to IEC Pub. 68-2-20. Appendix B.

· GX-7· ASAHI CHEMICAL RESEARCH LABORATORY. MI-820V TAMURA KAKEN CO., LTD or an equivalent flux shall be used. The flux used shall consist 15% by weight of rosin. 材料

(1) はんだ

JIS Z 3282に規定の63%Snはんだ(H63A)もしくは60% Snはんだ (H60A)

フラックス

アサヒ化研製 GX-7, タムラ化研製 MH-820V もしくは それと同等品で、固形分濃度は重量比15%

Flux フラックス	Specific gravity 比重(20℃)
ASAHI CHEMICAL RESEARCH LABORATORY GX-	0. 823
TAMURA KAKEN CO.; LTD MH-820リタムラ化研製	0. 824

(3) Printed wiring board
A board specified by NEMA(XPC) or it's equivalent board. Board shall be single-sided and its nominal thickness shall be specified in Clause "Resistance to flux penetration" with a copper foil thickness of $35\,\mu\text{m}$. The position of mounting holes for test component shall correspond exactly to the terminal configura-tion so that terminals fit exactly into the holes. Hole size shall be as specified. If not specified, hole size shall exceed the diameter (or exterior dimensions in the case of non-circular terminals) of terminals by 0.2 mm to 0.4 mm. Unless otherwise specified, the conductor land size shall exceed the diameter (or dimensions) of holes by 2 mm to 4 mm.

JIS C 6485で規定されたプリント基板 (P.P)もしくはこれ と関等品(厚さは、「耐フラックス上がり」の条件に規定 のもの35μm 片面網箔)に、部品のリード位置に対応して、 特に指定のない場合は(リード形状+0.2 ~0.4)mmの穴を あけたもの。(取付穴寸法指定がある場合はそれによる。) パターンランドは特に指定がない場合は、φ(リード外径 +2~4) 酬とする。

T est
(1) The printed wiring board specified in Clause 1 shall be scaled only soldering side in the flux specified in Clause 1 for 3 to 5 s. The board shall then be taken out of the flux.

(2) The test components, its electrical characteristics and mechanical characteristics specified in this specification having already been measured, shall be inserted completely into the board as soon as the

board is removed from the flux.

(3) Either the flux bath method or the foaming method shall be used to apply flux a second time to the board. in either case, flux shall not come into contact with the component side surface and fluxing time shall be 3 to 4 s.

Note: After fluxing, if preheating is necessary before mounting, then the surface of the solder side shall be heated to 75 °C to 90 °C for 1 min or less.

- (4) Using an automatic soldering system or a hand dipping system, the board shall be soldered up to the component side surface (but the solder shall not come into contact with the component side) for 5±1 s at 250 °C to 260 °C.
- (5) The board shall be subjected to standard atmospheric conditions for 24 h or more after the soldering. Tests shall then be carried out as specified below;

Visual inspection of appearance

Measurement of characteristics as specified

2 試

- 1項指定の基板を1項指定のフラックス液中に基板の片面 (1) を全面3~5秒間浸漬し、取り出す。
- 性能の初期測定を終了した部品をすみやかに、かつ、浮き がないようにマウントする。
- マウントした基板に、まず、基板上面スレスレまで指定のフラックスを塗布する。(フラックス塗布は、発泡式または静止液中浸漬により3~4秒間行なう。) (3)
 - 注:フラックス塗布後、プレヒートを行なう場合は、プレ ヒート時間は1分以内で基板のはんだ付面側の表面温 度が75~90℃になるようにする。
- その後自動はんだ付装置もしくは手ジャブにより、250~260℃のはんだ浴中で 5 ± 1 砂間浸漬しはんだ付けする。この時の浸渍深さは基板上面スレスレに達するように行な
- はんだ付けが終ったのち室温に24時間以上放置し、その後、 (5) 下記項目を調べる。 ① 目視による外観

② 規格に規定の性能の測定

·					AU	MAL	PS E	LECTRIC CO., LTD.
					APPD 1-573	CHKD.	DSGD,	POTENT I OMETER 可変抵抗器
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.	V.		94.6.17	DOCUMENT NO. 4K5021-2 (1/12)

